

		△の数	訂正	記事	事	担当	検図	年月日		△の数	訂正	記事	事	担当	検図	年月日										
△		2	RE-F-09504				中村	山口	04.02.27	△																
△		1	RE-F-10251				土井	小沢	05.02.02	△																
適用規格																										
定 格	使用温度範囲		-55℃ ～ 85℃				保存温度範囲		-10℃ ～ 60℃ (注3)																	
	電 圧		AC 100 V				使用湿度範囲		40 % ～ 80 %																	
	電 流		0.4 A				保存湿度範囲		40 % ～ 70 % (注3)																	
性 能																										
	項 目		試 験 方 法				規 格				QT	AT														
構造	外観、構造及び仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○														
	表示		目視にて確認する。								○	○														
電気的 性能	接触抵抗		100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。				80 mΩ以下 (注1)				○	—														
	低電圧、低電流下の 接触抵抗		20 mV以下、1 mA (DC または 1000 Hz) で 測定する。				100 mΩ以下 (注2)				○	—														
	絶縁抵抗		DC 250 Vで測定する。				100 MΩ以上				○	—														
	耐電圧		AC 300 Vの電圧を1分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。				○	—														
機械的 性能	総合挿抜力		適合コネクタで測定する。				差込力 (0.7×極数) N以下 引抜力 (0.065×極数) N以上				○	—														
	繰り返し動作		50 回の抜き差しを行う。				① 接触抵抗: 100 mΩ以下 (注2) ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—														
	耐振性		周波数 10 ～ 55 Hz、振幅 1.5 mm、 3 方向各 2 時間試験する。				① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 100 mΩ以下 (注2)				○	—														
	耐衝撃性		加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3方向各 3 回試験する。				③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—														
環境的 性能	定常状態の耐湿性		温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。				① 接触抵抗: 100 mΩ以下 (注2) ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上				○	—														
	温度サイクル		温度 -55→+15→+35→+85→+15→+35℃ 時間 30→ 2～3 → 30→ 2～3 分 を 5 サイクル試験する。				③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—														
	塩水噴霧		濃度 5 % の塩水、48 時間放置する。				① 接触抵抗: 100 mΩ以下 (注2)				○	—														
	硫化水素		濃度 3 ppm、 96 時間放置する。 (試験規格: JEIDA 38)				② はなはだしい腐食がないこと。				○	—														
	はんだ耐熱性		リフローの場合: ピーク温度 MAX250℃ 220℃以上 60秒以内				外観の変形及び端子などに著しい ガタがないこと。				○	—														
			はんだごての場合: こて温度 360℃ はんだ付け時間 5 秒以内 △								○	—														
はんだ付け性		△ △	はんだ温度 240±3℃、浸せき時間 3 秒間のはんだ付けを行う。				はんだ浸せき面の 95 %以上が 新しいはんだでぬれていること。				○	—														
備考										製 図		担 当		検 図		承 認		出 図								
注1. 本製品のスタッキング高さ16mmタイプでの導体抵抗を考慮し、接触抵抗の初期値を80mΩとする。 注2. 試験後、初期値からの変化量が20mΩ以下のこと。 注3. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。 試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。										HIF 03.01.17 鈴木		HIF 03.01.17 中村		HIF 03.01.17 大川		IC 03.01.20 吉村										
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目																										
製品規格表																										
製品名										FX8C-※※S-SV (92)																
IBCL CL																	図番				製品コード				1	
SLC4-151022-22																	CL578									

